## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2005年12月1日(01.12.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/113401 A1

(51) 国際特許分類7:

B66B 5/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/007404

(22) 国際出願日:

2004年5月24日(24.05.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

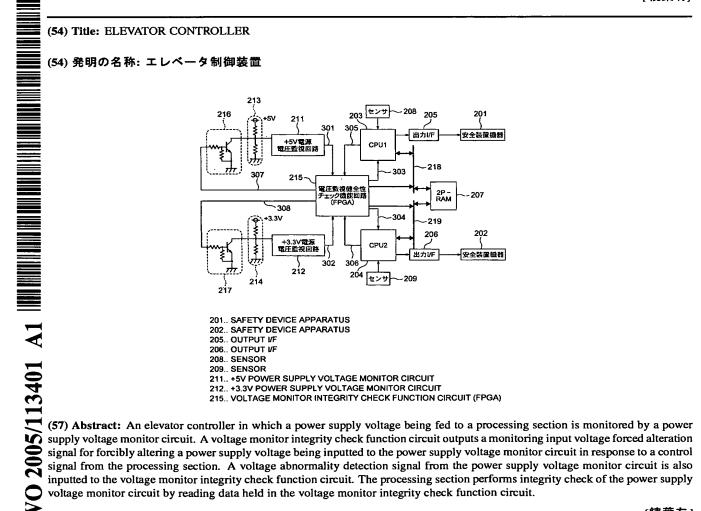
日本語

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について):三 菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内 二丁目2番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 地田 章博 (CHIDA, Akihiro) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区

丸の内二丁目2番3号三菱電機株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 曾我 道照, 外(SOGA, Michiteru et al.); 〒 1000005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号国際 ビルディング 8階 曾我特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]



voltage monitor circuit by reading data held in the voltage monitor integrity check function circuit.



#### 

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  $\exists$  ーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### 添付公開書類:

## 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。